

บทที่ 2

หลักการที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ประกอบด้วยคุณสมบัติและโครงสร้างของแร่ ตระกูลคอรันดัม (corundum) ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแสงและวัสดุ อันตรกิริยาระหว่างไอโอดิน และวัสดุ ทัศนศาสตร์ของผลึก เครื่องมือต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคอรันดัม

2.1.1 คุณสมบัติทั่วไปของคอรันดัม (Hughes, 1997)

สูตรเคมี	Al_2O_3
ระบบ	Hexagonal
จุดหลอมเหลว	2030 - 2050 °C
จุดเดือด	3500 °C
ค่าดัชนีหักเห	$n_E = 1.762$, $n_O = 1.770$
ไบเรฟพรินเจนส์	0.008 – 0.009
ลักษณะจักชุ	Uniaxial (-)
ความถ่วงจำเพาะ	3.98 – 4.06
ความหนาแน่น	3.986 กรัม/ซม. ³
ความแข็ง	9 (Mohs' scale)

Thermal diffusivity ($\text{cm}^2 \text{s}^{-1}$)

- c axis 0.101

- a axis 0.0937

Thermal expansion

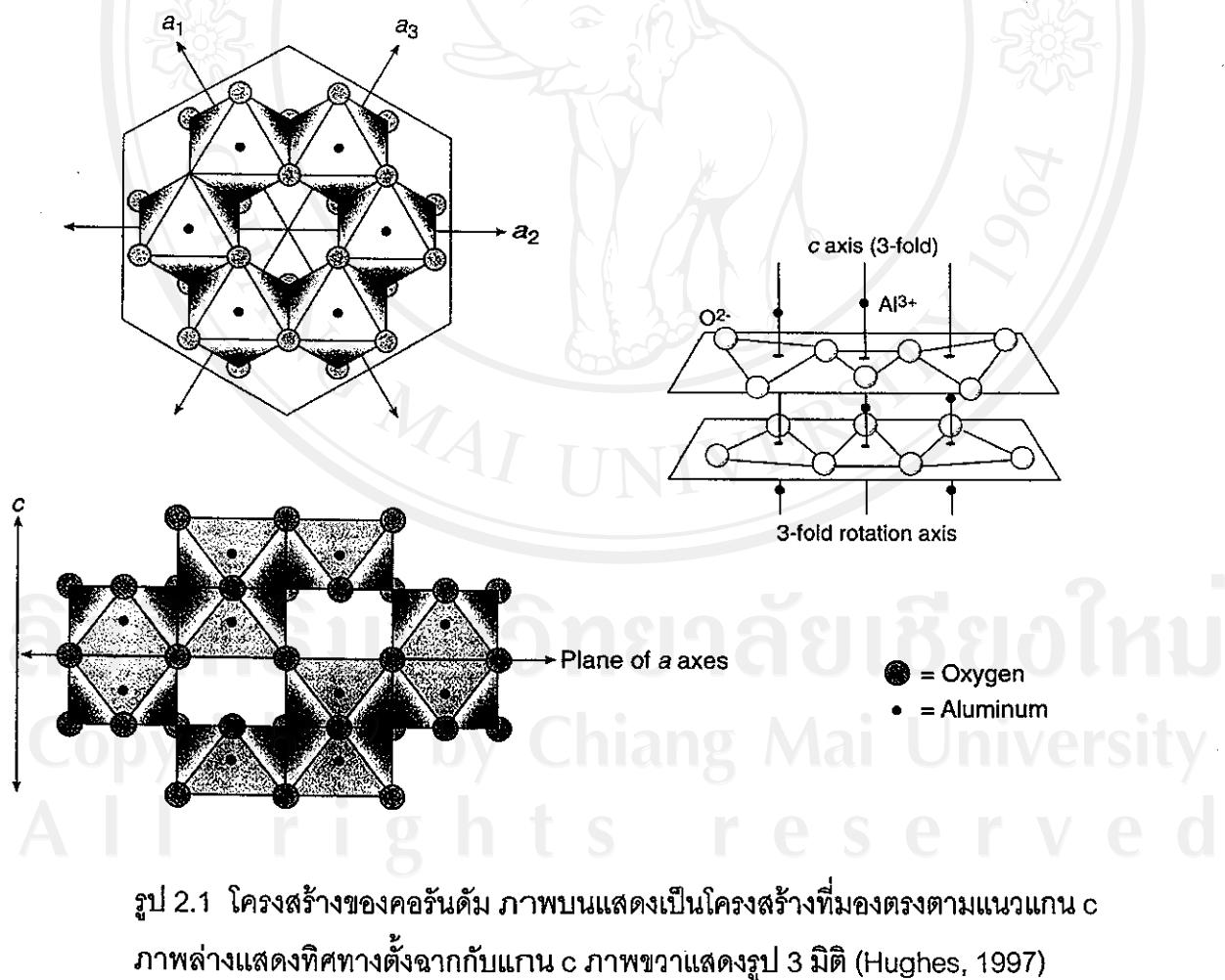
- // to c axis $20-50^\circ\text{C} = 6.66 \times 10^{-6}$

- // to c axis $20-1000^\circ\text{C} = 9.03 \times 10^{-6}$

- ⊥ to c axis $50^\circ\text{C} = 5.0 \times 10^{-6}$

2.1.2 โครงสร้างผลึกของคอร์นดัม

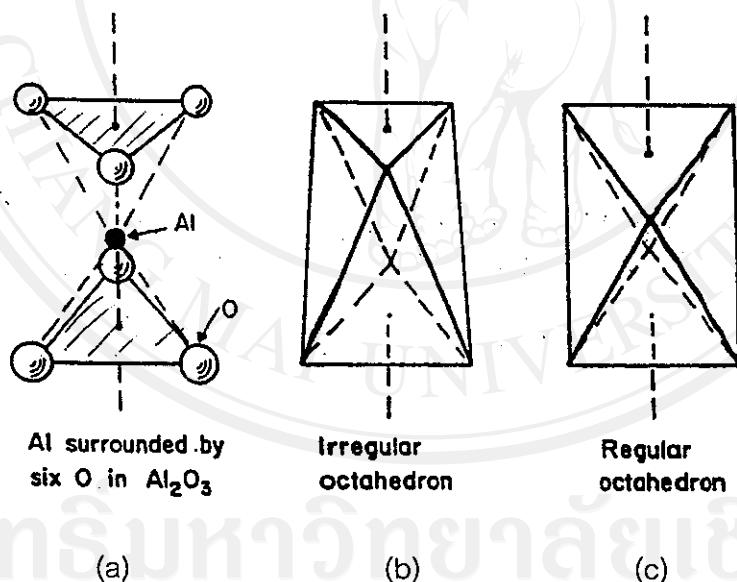
คอร์นดัมบริสุทธิ์จะไม่มีสีประจำบด้วยอะลูมิเนียมร้อยละ 52.91 และออกซิเจนร้อยละ 47.08 (Themelis, 1992) เป็นสารประจำบดชนิดที่มี พันธะเคมีในคอร์นดัมมีสองแบบหลักคือ พันธะไอโอดินิกประมาณร้อยละ 60 และพันธะโควาเลนท์ประมาณร้อยละ 40 (Nassau, 1983) อะตอมอะลูมิเนียมมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดสามตัว (Al^{3+}) อะตอมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดสองตัว (O^{2-}) คอร์นดัมเป็นผลึกที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง โดยออกซิเจนไอโอดินซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไอโอดิน 2.8 อังสตروم (\AA) จัดเรียงตัวเป็นชั้นแบบเขกขาgonal (hexagonal packed layers) ในช่องว่างระหว่างออกซิเจนไอโอดินห้อง 6 ตัว จะมีอะลูมิเนียมไอโอดินซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไอโอดิน 1.1 อังสตروم แทรกอยู่ ดังรูป 2.1



รูป 2.1 โครงสร้างของคอร์นดัม ภาพบนแสดงเป็นโครงสร้างที่มองตรงตามแนวแกน c ภาพล่างแสดงทิศทางตั้งฉากกับแกน c ภาพขวาแสดงรูป 3 มิติ (Hughes, 1997)

อะลูมิเนียมไอออกอนวางตัวในโครงผลึกที่มีออกซิเจนไอออกอนล้อมรอบ 6 ตำแหน่ง โดยในช่องว่างของ octahedral ทุกๆ สามช่องจะมี Al^{3+} บรรจุเพียงสองช่อง เนื่องจาก bond strength ของพันธะ $\text{Al}^{3+} - \text{O}^{2-}$ จะทำให้มีช่องว่างหนึ่งช่องเกิดขึ้น ออกซิเจนแต่ละตัวจะใช้ร่วมกันระหว่าง octahedral สี่กลุ่ม รูป 2.1 บน เป็น basal plane {0001} ที่ออกซิเจนแต่ละตัวแสดงพันธะ Al-O เพียงสองพันธะ นั่นคือออกซิเจนแต่ละตัวจะเป็นตำแหน่งมุมของ octahedral สี่กลุ่ม

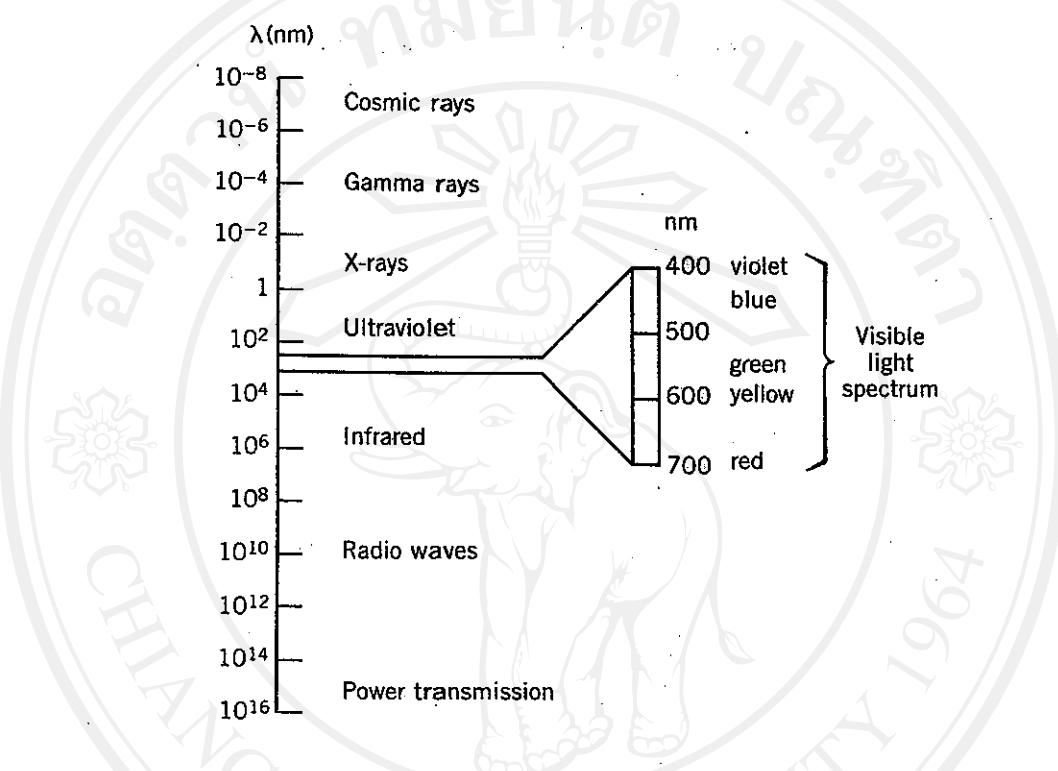
หากพิจารณาเฉพาะบริเวณที่มีอะตอมของอะลูมิเนียมเพียงตำแหน่งเดียวในโครงสร้าง Al_2O_3 จะเห็นว่ามันถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจนไอออกอนหกตัว ทำให้มีลักษณะเป็น distorted octahedral เนื่องจาก bond strength ต่างกันมากตามลำดับ ทำให้ไอออกอนของอะลูมิเนียมอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางระหว่างชั้นของออกซิเจนเล็กน้อย แสดงดังรูปที่ 2.2 (a) และ (b) สวนรูปที่ 2.2(c) ตำแหน่งของอะลูมิเนียมไอออกอน อยู่กึ่งกลางระหว่างชั้นออกซิเจนไอออกอนเกิดเป็นโครงสร้างทรงเหลี่ยมแปดหน้าแบบสมมาตรรูปเกลี้ยง (regular octahedron)



รูป 2.2 (a) และ (b) แสดง distorted octahedral ของลิแกนด์ออกซิเจนรอบอะลูมิเนียม ไอออกอน (c) ทรงเหลี่ยมแปดหน้าแบบสมมาตรรูปเกลี้ยง (Nassau, 1983)

2.2 อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ

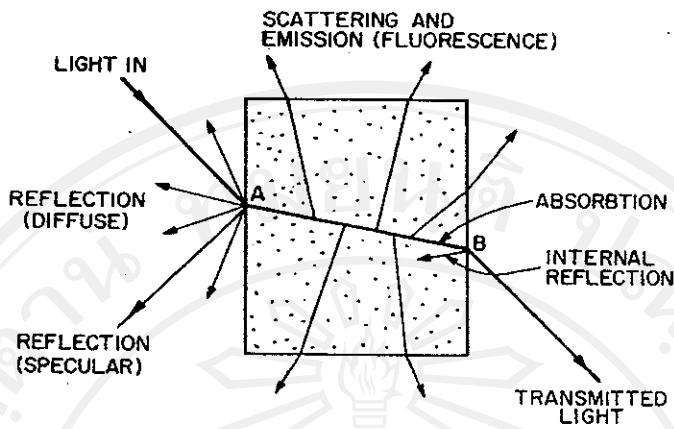
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) ชนิดหนึ่ง ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีความยาวคลื่นประมาณ 400-700 นาโนเมตร ดังรูป 2.3



รูป 2.3 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น (Klein, 2002)

เมื่อแสงตกกระทบวัสดุ แสงบางส่วนจะเกิดการสะท้อน (reflection) บางส่วนเกิดการกระจาย (diffuse) แสงที่ผ่านเข้าไปในตัววัสดุ บางส่วนถูกดูดกลืน (absorb) และกระเจิง (scatter) หรือสะท้อนภายในตัววัสดุ (internally reflected) แสงส่วนที่เหลือจะผ่าน (transmit) ออกจากการวัดถูก ดังรูป 2.4

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved



รูป 2.4 อันตรกิริยาของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านวัสดุโปร่งแสง (Nassau, 1983)

การที่วัตถุมีสีเนื่องจากเมื่อแสงตกกระทบผิววัสดุ พลังงานแสงส่วนที่ถูกดูดกลืนจะระดับอิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนย้ายวงโคจรจากระดับพลังงานต่ำกว่าไปยังระดับพลังงานสูงกว่า หากวัตถุนั้นดูดกลืนคลื่นแสงซึ่งความยาวคลื่นหนึ่งไว้ สีที่มองเห็นจะเป็นสีในซึ่งความยาวคลื่นที่เหลือ ดังนั้นสีที่มองเห็นจึงเป็นสีเติมเต็ม (complementary color) กับสีของพลังงานแสงที่ถูกดูดกลืน เช่น หากวัตถุดูดกลืนเฉพาะช่วงแสงสีแดง แสงที่มองเห็นจะเป็นสีที่เป็นสีเติมเต็มของสีแดง คือซึ่งแสงสีเขียว จึงทำให้มองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีเขียว เป็นต้น สีเติมเต็มและความสัมพันธ์ระหว่างสีที่ถูกดูดกลืนกับสีที่เข้าสูญญากาศ แสดงไว้ ตาราง 2.1

พลังงานของคลื่นแสงสามารถคำนวณได้จากสมการของ Planck ดังสมการ (2.1)

$$E = h\nu = hc/\lambda \quad (2.1)$$

โดยที่ E คือ พลังงานของคลื่นแสง

h คือ Planck's constant ($6.626176 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

ν คือ ความถี่ของคลื่นแสง

c คือ ความเร็วของคลื่นแสง

λ คือ ความยาวคลื่น

ตารางที่ 2.1 คลื่นแสงที่ถูกสารดูดกลืนและสีทึมของเห็น

ความยาวคลื่นที่ถูกดูดกลืน (nm)	สีที่ถูกดูดกลืน	สีทึมของเห็น
400 - 450	ม่วง	เหลืองแกมเขียว
450 – 480	น้ำเงิน	เหลือง
480 – 490	เขียวแกมน้ำเงิน	ส้ม
490 – 500	น้ำเงินแกมเขียว	แดง
500 – 560	เขียว	คราม
560 – 580	เหลืองแกมเขียว	ม่วง
580 – 600	เหลือง	น้ำเงิน
600 – 650	ส้ม	เขียวแกมน้ำเงิน
650 - 750	แดง	น้ำเงินแกมเขียว

ในการวัดการดูดกลืนแสงของวัตถุทำได้โดยให้ลำแสงผ่านเข้าไปในสารตัวอย่าง แล้ววัดปริมาณของแสงที่ทะลุออกมานะ โดยการเปรียบเทียบกับแสงที่ทะลุออกมานะเมื่อไม่มีสารตัวอย่าง ค่าการดูดกลืนแสง สามารถคำนวณได้ตามกฎของ Beer ดังสมการ

$$I = I_0 10^{-abc} \quad (2.2)$$

หรือ

$$A = abc = \log \frac{I_0}{I} \quad (2.3)$$

โดยที่ A คือ การดูดกลืนแสง (absorbance)

a คือ แอบซอร์พติวิตี้ (absorptivity)

b คือ ความกว้างของเซลล์ เป็น ซม.

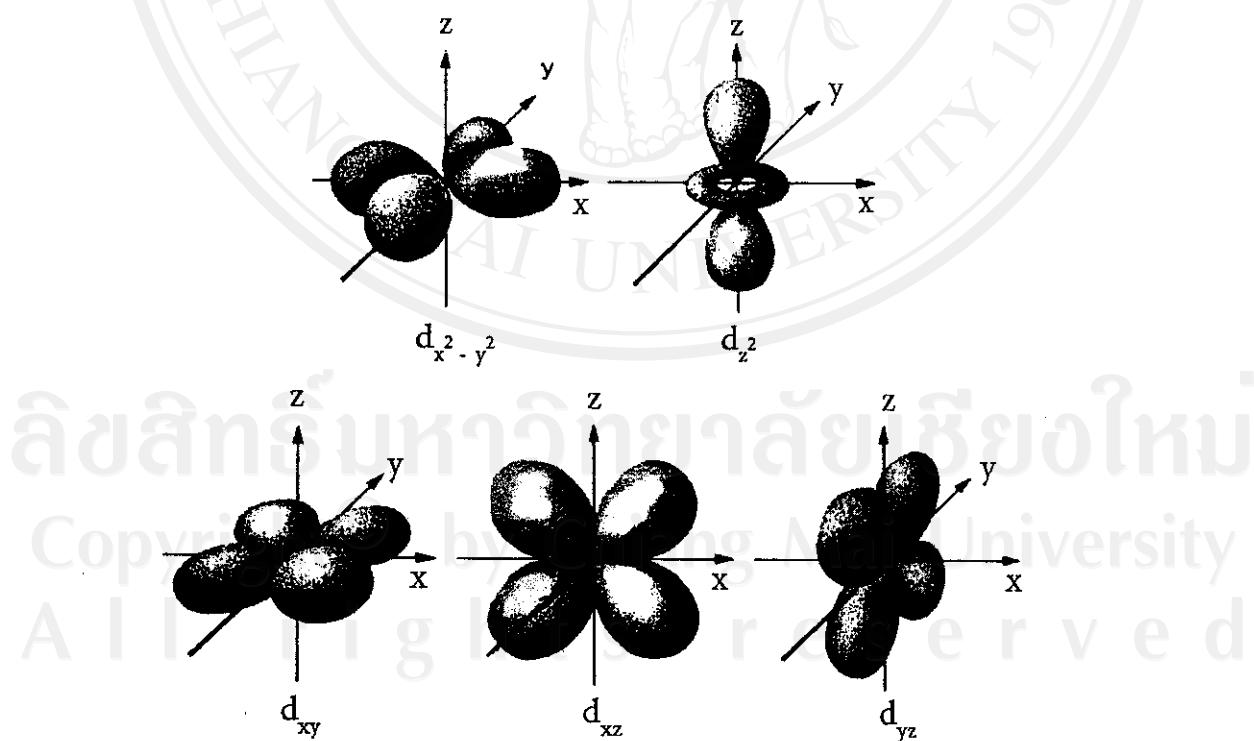
C คือ ความเข้มข้น เป็น มอล/ลิตร

I_0 คือ ความเข้มแสงตกกระทบ (incident light intensity)

I คือ ความเข้มแสงที่ผ่านออกมานะ (transmitted light intensity)

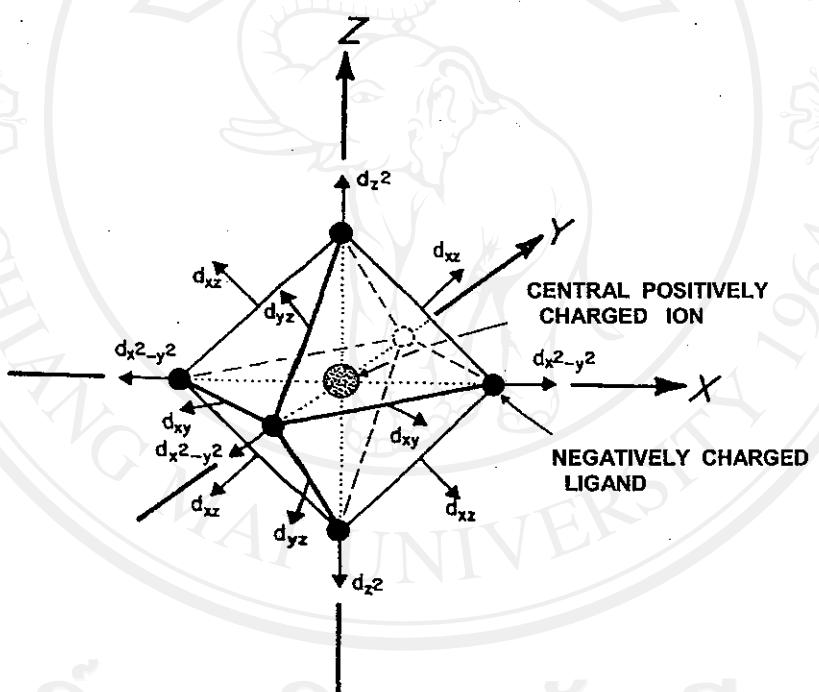
2.2.1 ทฤษฎีสนามผลลัพธ์

ทฤษฎีสนามผลลัพธ์ (Crystal Field Theory, CFT) ที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ได้อ้างตามคิดของ Nassau (1983) ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ใช้อธิบายการเกิดพันธะในสารเชิงชั้นของธาตุทรายซึ่งเนื่องจากสามารถอธิบายเกี่ยวกับการมีสีหรือการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ ทฤษฎีนี้ได้เสนอขึ้นมาครั้งแรกเพื่อใช้อธิบายการตักจับ (trap) ไอออนของโลหะไว้ในโครงผลลัพธ์ ทฤษฎีสนามผลลัพธ์พิจารณาถึงแรงยึดในสารเชิงชั้นว่าเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาถึงพันธะแบบโคลาเลน์ คือกล่าวถึงอิทธิพลของสนามลิแกนด์ (ligand field) ที่มีต่อระดับพลังงานของ d-ออร์บิตอล (d-orbitals) ซึ่งรูปทรงของ d-ออร์บิตอล ทั้ง 5 แบบแสดงดังรูป 2.5 โดยเมื่อพิจารณาถึงทิศทางของกลุ่มอิเล็กตรอนพบว่า d_{z^2} และ $d_{x^2-y^2}$ นั้นมีทิศทางซึ่งเปลี่ยนทิศของลิแกนด์ ส่วน d_{xy} , d_{yz} และ d_{xz} นั้นจะซึ่งเปลี่ยนทิศระหว่างลิแกนด์ โดย d-ออร์บิตอล ทั้ง 4 คือ d_{xy} , d_{yz} , d_{xz} และ $d_{x^2-y^2}$ มีรูปร่างคล้ายกัน คือประกอบด้วยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน (electron cloud) 4 lobes ส่วน d_z^2 ประกอบด้วย 2 lobe ซึ่งมีทิศทางซึ่งเปลี่ยนด้านบากและด้านลบของแกน Z และมีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนที่เป็นวงกลม อยู่บนระนาบ XY



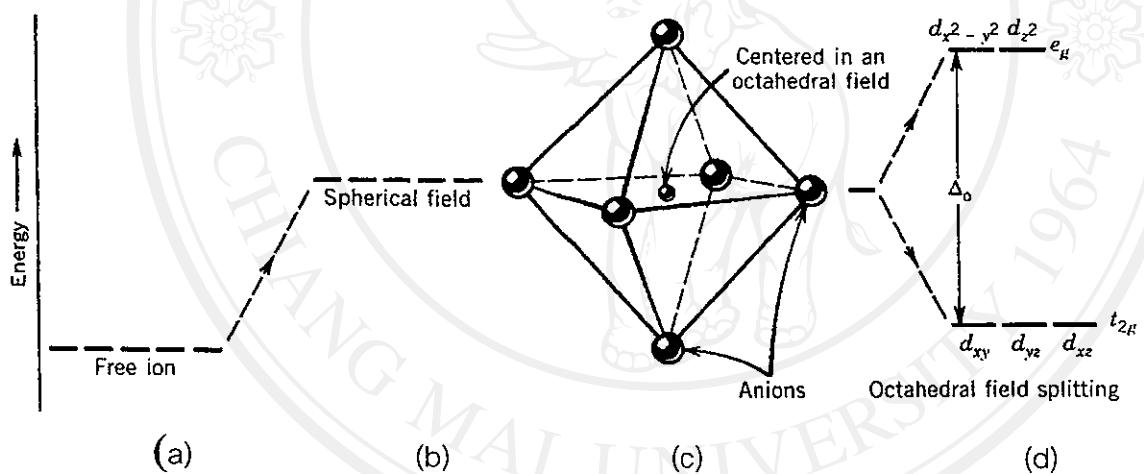
รูป 2.5 รูปร่างและทิศทางของ d-ออร์บิตอล (ทบทวนมหาวิทยาลัย, 2538)

เมื่อไอโอนอยู่ในสภาวะอิสระ คืออยู่ในสถานะที่เป็นก้าว d-ออร์บิ托ล ของไอโอนโลหะทั้ง 5 ออร์บิ托ล จะมีพลังงานเท่ากันหมด (5-fold degeneracy) แต่เนื่องจากสารเชิงชั้นของโลหะท่านซึ่นแมกมีรูปทรงทางเรขาคณิตเป็นแบบ octahedron ลิแกนด์ทั้งหกกลุ่มซึ่งเป็น anion จะเข้าไปเกิดพันธะกับ cation ของโลหะท่านซึ่นซึ่งเป็นอะตอมกลาง ดังนั้นมีแรงทางไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นทำให้เกิดสนามลิแกนด์ขึ้นในสารเชิงชั้นนี้ผลให้พลังงานใน 3d-ออร์บิ托ล ทั้ง 5 ออร์บิ托ลไม่เท่ากันทั้งหมด การเรียงลิแกนด์ทั้งหกรอบไอโอนของโลหะเมื่อเกิดเป็น octahedral complex และทิศทางของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของ d-ออร์บิ托ล แสดงดังรูป 2.6



รูป 2.6 การเรียงลิแกนด์ทั้งหกรอบไอโอนของโลหะเมื่อเกิดเป็น octahedral complex
(Nassau, 1983)

ถ้าบ่าวรูจุอิเล็กตรอน 1 ตัว เข้าไปในออร์บิทอล อิเล็กตรอนนี้จะต้องอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำสุด ด้วยเหตุนี้พลังงานของ d ออร์บิทอล จึงไม่เท่ากันอีกต่อไป คือ มี 3 ออร์บิทอล ที่มีพลังงานต่ำกว่าเดิม คือ d_{xy} , d_{yz} และ d_{zx} แทนด้วย t_{2g} และมี 2 ออร์บิทอล ที่มีพลังงานสูงกว่าเดิม คือ d_{z^2} และ $d_{x^2-y^2}$ แทนด้วย e_g ผลต่างของระดับพลังงานสัมพัทธ์ระหว่าง e_g กับ t_{2g} เรียกว่า splitting energy (หรือ crystal field splitting energy) เรียนแทนด้วย Δ_0 ดังรูป 2.7(d) ยิ่งค่า splitting energy มากเท่าไรพลังงานแสง ($h\nu$) ที่ต้องใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนจาก t_{2g} ไปยัง e_g ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

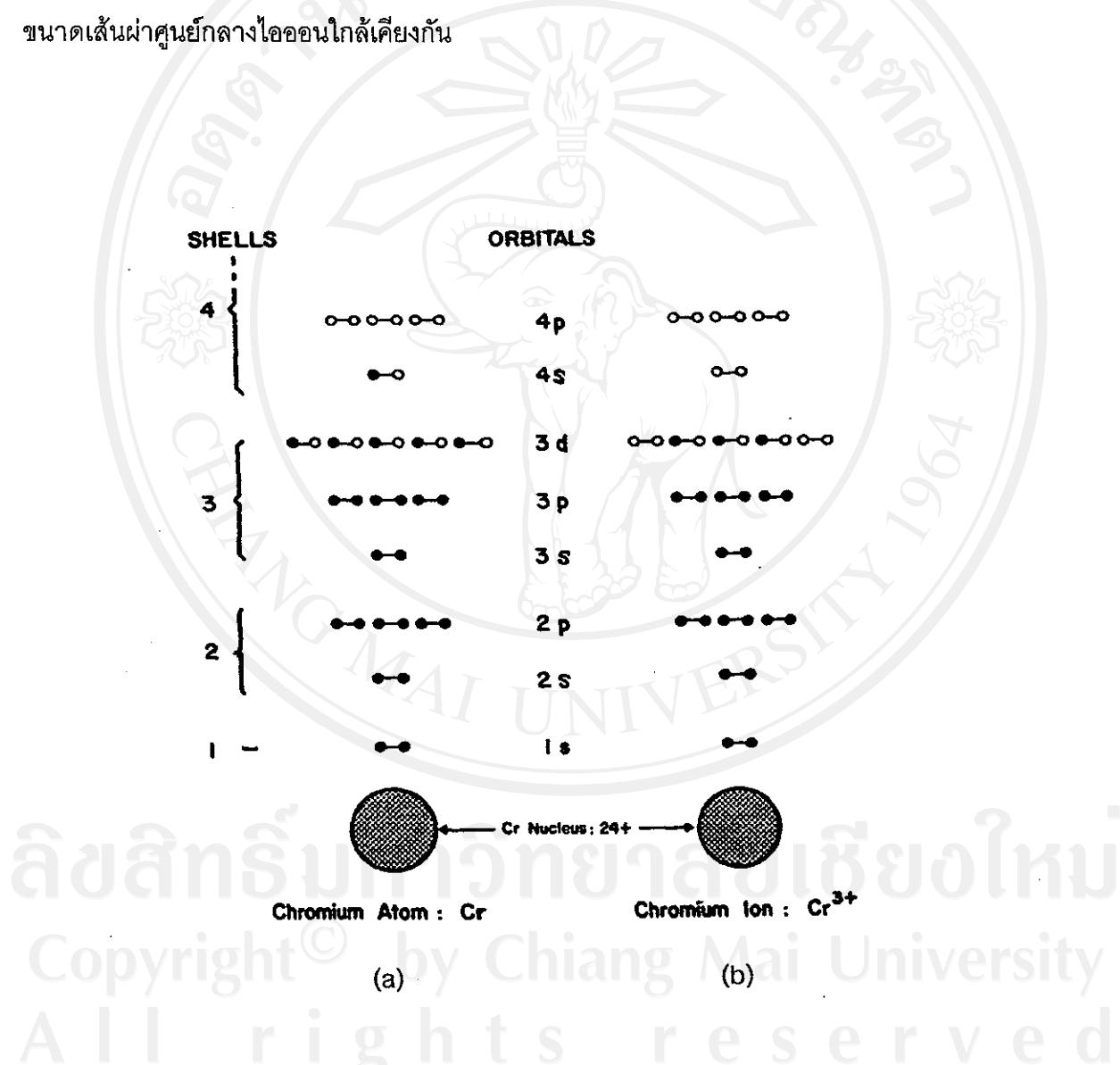


รูป 2.7 ระดับพลังงาน 3d-ออร์บิทอล ของโลหะทรานซิชัน (a) ไอออนอิสระ (b) ไอออนในสภาพที่ถูกล้อมรอบด้วยปะจุลับ (c) ไอออนของโลหะทรานซิชันที่อยู่ใน octahedral field ของแคนไอก่อน (d) การแยกพลังงาน (energy separation) เนื่องจากสนามแม่เหล็ก (Klein, 2002)

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

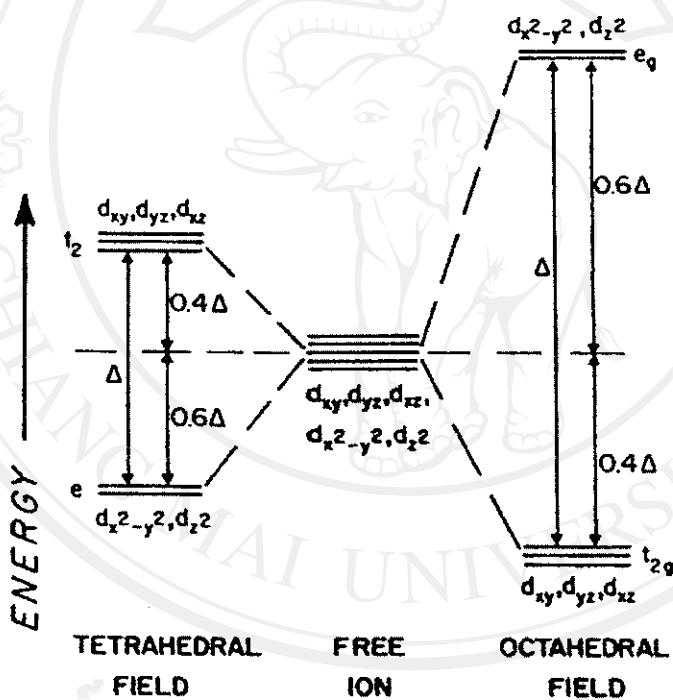
2.2.2 โครงเมียมและการเกิดสีในหับทิม

ผลึกครอวันดัมที่มีองค์ประกอบเป็น Al_2O_3 บริสุทธิ์จะปรากฏเป็นผลึกใส่ไม่มีสี เมื่อผลึกครอวันดัมมีโครงเมียมไอโอกอน (Cr^{3+}) ประมาณร้อยละ 1 เข้าแทนที่ตำแหน่งของอะลูมิเนียมไอโอกอน (Al^{3+}) เกิดเป็น Cr_2O_3 จะทำให้เกิดสีแดงเรียกว่าหับทิม (ruby) ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการอธิบายถึงการเกิดสีในหับทิม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก Nassau (1983) การที่ Cr^{3+} ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไอโอกอน 1.2 อังสตروم สามารถเข้าแทนที่ตำแหน่งของ Al^{3+} ในผลึกได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไอโอกอนใกล้เคียงกัน



รูป 2.8 (a) การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมโครงเมียม (b) การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในโครงเมียมไอโอกอน (Nassau, 1983)

โครงสร้างการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในโครเมียมดังรูป 2.8 แสดงการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมโครเมียมและในโครเมียมไอโอน ในรูป 2.8 (a) อิเล็กตรอนเรียงตัวอยู่เต็มในชั้น 3s และ 3p และมีอิเล็กตรอนอยู่ในชั้น 3d จำนวน 5 ตัว และ อีก 1 ตัวอยู่ในชั้น 4s รูป 2.8 (b) แสดงการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในโครเมียมไอโอน อิเล็กตรอนวงนอกสุดมีการจัดเรียงตัวเป็น $3d^3$ จึงเกิดเป็นอิเล็กตรอนคู่โดยเดียว 3 ตำแหน่ง โดยตามกฎของ Hund (Hund's rule of maximum multiplicity) อธิบายได้ว่า เมื่อมีอิเล็กตรอนหลายตัวในวงโคจรที่พลังงานต่ำสุดหรือ สภาวะปกติ มักจะพบว่า อิเล็กตรอนเรียงตัวเป็นอิเล็กตรอนคู่โดยเดียวเสมอ เพื่อให้มีพลังงานต่ำที่สุด ดังนั้น โครเมียมไอโอนจึงสามารถเกิดเป็นสารประกอบได้หลายแบบ เช่น Cr^{2+} , Cr^{3+} และ Cr^{6+} ซึ่งในทับทิม โครเมียมมีอยู่ในรูปของ Cr^{3+} ทำให้เกิดเป็น Cr_2O_3



รูป 2.9 ระดับพลังงานของโครเมียมเมื่อมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างกัน (Nassau, 1983)

ระดับพลังงานในรูปที่ 2.9 ภาพกลางแสดงระดับพลังงานอิเล็กตรอนแต่ละตัวของ โครเมียมไอโอนอิสระมี 5 ระดับ (d shell) ภาพข้ายังแสดงการแยกชั้นระดับพลังงานเมื่อมีอยู่ใน สนามลิแกนด์ของ tetrahedral ภาพขวาแสดงการแยกชั้นระดับพลังงานเมื่อมีอยู่ใน สนามลิแกนด์ของ octahedral แสดงให้เห็นว่า ระดับพลังงานที่แยกออกจากกันจะขึ้นกับลักษณะการวางตัวของ อะตอมที่ล้อมรอบในโครงสร้าง

2.3 ทัศนศาสตร์ของผลึก

วัตถุนิดต่างๆ สามารถจำแนกตามปฏิกิริยาต่อแสงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) วัตถุไอโซโทรปิก (isotropic substance) เป็นวัตถุที่ทำปฏิกิริยาต่อแสงในทุกทิศทาง เหมือนกันหมด ได้แก่ วัตถุอสันฐานและผลึกที่อยู่ในระบบ isometric

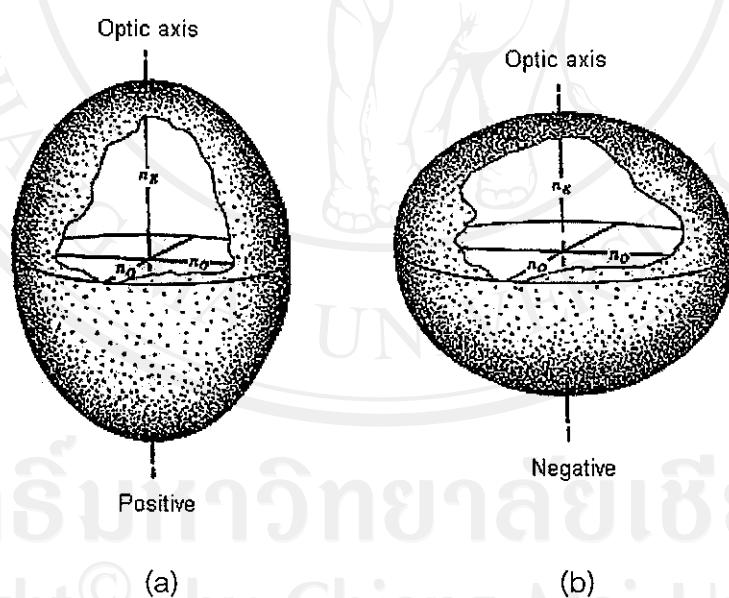
2) วัตถุแอนไอโซโทรปิก (anisotropic substance) เป็นวัตถุที่ทำปฏิกิริยาต่อแสงไม่เหมือนกันในทุกทิศทาง สามารถจำแนกเป็น 2 ชนิดคือ ผลึกแกนเดียว (uniaxial crystal) ได้แก่ ผลึกในระบบ tetragonal, trigonal และ hexagonal และผลึกแกนคู่ (biaxial crystal) ได้แก่ ผลึกในระบบ orthorhombic, monoclinic และ triclinic ผลึกแกนแสงเดียวยังมีทิศทางอยู่ทิศทางหนึ่งที่แสงเคลื่อนที่ผ่านในลักษณะคล้ายกับวัตถุไอโซโทรปิก ผลึกแกนแสงคู่มีทิศทางอยู่สองทิศทางที่แสงเคลื่อนที่ผ่านในลักษณะคล้ายกับวัตถุไอโซโทรปิก ทัศนศาสตร์ของผลึกได้ถูก่าว่าไว้อย่างละเอียดโดย Wahlstrom (1969) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะผลึกแกนเดียวเนื่องจากลักษณะทางแสงของคริสตัลเป็นแบบผลึกแกนเดียว

ถ้าให้แสงที่ส่องในระนาบเดียวกับกระแทบผลึกแกนแสงเดียว ในทิศทางไม่ขนานกับแกนแสง แสงจะแยกออกเป็นสองรังสี (ray) ซึ่งมีความเร็วต่างกัน ทิศทางการสั่นของคลื่นแสงทั้งสองตั้งฉาก ซึ่งกันและกัน คลื่นแสงที่สั่นอยู่ในภาคตัดวงกลม (circular equatorial plane) ซึ่งตั้งฉากกับแกนแสง เรียกว่า คลื่นแสงธรรมดा (ordinary wave) หรือ O wave ทิศทางการสั่นของ O wave ขนาน กับผิวที่แสงตกกระทบเสมอ ทิศทางการเคลื่อนที่ของ O wave เรียกว่า รังสีธรรมดា (ordinary ray) หรือ O ray ทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการสั่นของ O wave เรียกว่า แนวฉากคลื่นแสงธรรมดា (ordinary wave normal) หรือ O wave normal ดัชนีหักเหสำหรับ O wave (index for ordinary wave) มีสัญลักษณ์เป็น n_0 หรือ O

คลื่นแสงที่สั่นในภาคตัดหลัก (principle section) เรียกว่าคลื่นแสงพิเศษ (extraordinary wave) หรือ E wave ทิศทางการสั่นของ E wave ขนานกับผิวที่แสงตกกระทบเมื่อมุมตกกระทบ เป็นมุมจาก ทิศทางการเคลื่อนที่ของ E wave เรียกว่า รังสีพิเศษ (extraordinary ray) หรือรังสี E ray ทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการสั่นของ E wave เรียกว่า แนวฉากคลื่นแสงพิเศษ (extraordinary wave normal) หรือ E wave normal โดย E wave ที่สั่นขนานกับแกนแสงทำให้ดัชนีหักเหสำหรับ คลื่นแสง E มีค่ามากที่สุด (กรณี positive uniaxial crystal) หรือน้อยที่สุด (กรณี negative uniaxial crystal) ดัชนีหักเหสำหรับ E wave มีสัญลักษณ์เป็น n_E หรือ E โดย E wave ที่สั่นไม่ ขนานกับแกนแสงทำให้ดัชนีหักเหสำหรับ E ray มีค่าอยู่ระหว่าง n_0 และ n_E ทิศทางที่ O ray และ

E ray มีความเร็วเท่ากันนั้นมีเพียงทิศทางเดียว คือทิศทางที่ขานานกับแกน C ซึ่งก็คือ แกนแสง (optic axis) นั่นเอง

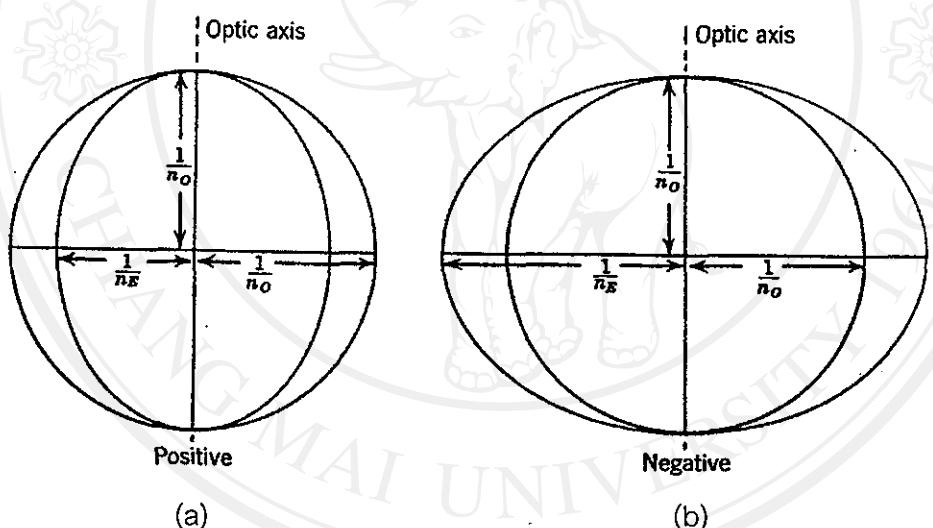
ด้วยน้ำหนักของผลึกแกนแสงเดียว จึงกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง โดยเครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียว (uniaxial indicatrix) มี 2 แบบ ได้แก่ เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียว ชนิดบวก (positive uniaxial indicatrix) และ เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียวชนิดลบ (negative uniaxial indicatrix) โดย Huygens ได้อธิบายลักษณะของแกนแสงที่เคลื่อนที่ผ่านผลึกในทุกทิศทุกทางว่ามีความแตกต่างกันโดย เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียวชนิดบวก (รูป 2.10(a)) มีลักษณะคล้ายลูกกรรไน์ (prolate ellipsoid) โดยมีครึ่งหนึ่งของแกนยาวเป็นสัดส่วนโดยตรงกับด้านน้ำหนักเที่ยมค่าสูงสุด (n_E) ครึ่งหนึ่งของแกนสั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับด้านน้ำหนักเที่ยมค่าต่ำสุด (n_O) ส่วนเครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียวชนิดลบ (รูป 2.10(b)) มีลักษณะคล้ายจานบิน (oblate ellipsoid) โดยมีครึ่งหนึ่งของแกนยาวเป็นสัดส่วนโดยตรงกับด้านน้ำหนักเที่ยมค่าสูงสุด (n_O) ครึ่งหนึ่งของแกนสั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับด้านน้ำหนักเที่ยมค่าต่ำสุด (n_E)



รูป 2.10 (a) เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียวชนิดบวก (b) เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดียวชนิดลบ (Wahlstrom, 1969)

การที่ความเร็วแสงในผลึกแกนเดี่ยวไม่เท่ากัน ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มทางแสง (optical group) ของ ผลึกได้เป็นสองกลุ่ม โดยการเข้ามามุ่ดตัวแทนความเร็วของคลื่นแสง O ray และ E ray ในทิศทางต่างๆ ของรังสี ทำให้เกิดผิวความเร็วของคลื่นแสง (ray-velocity surface) โดยกรณีที่ ผลึกแกนแสงเดี่ยวเป็นชนิดบวก ($n_E > n_o$) O ray-velocity surface มีลักษณะเป็นทรงกลม และมี รัศมีเท่ากับ $1/n_o$ และ E ray-velocity surface มีลักษณะคล้ายลูกกรรไน์ ที่มีรัศมีเท่ากับ $1/n_E$ ซึ่ง ray-velocity surface ของภาคตัดหลักแสดงในรูป 2.11(a)

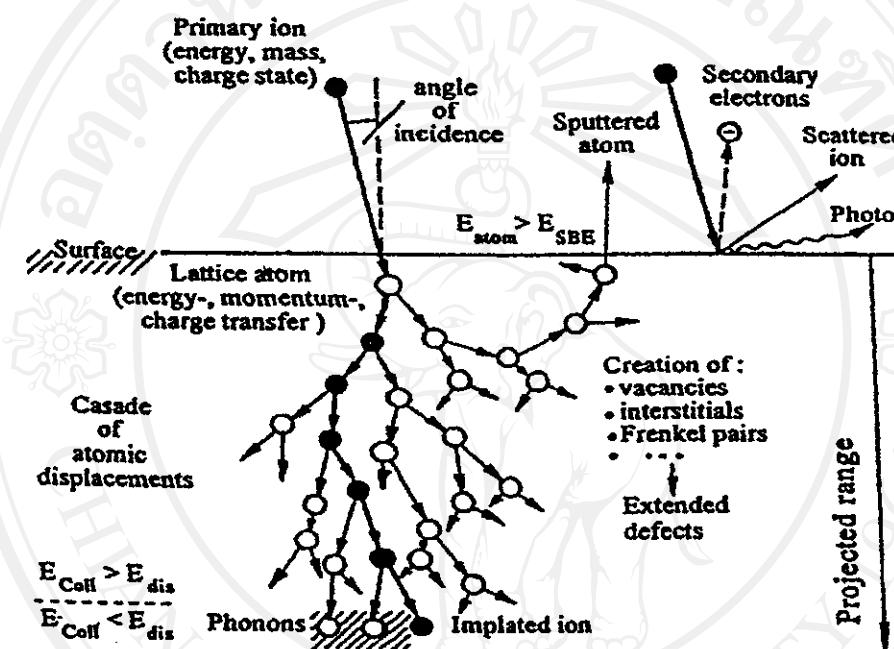
กรณีของ ผลึกแกนแสงเดี่ยวชนิดลบ ($n_E < n_o$) O ray-velocity surface มีลักษณะเป็นทรง กลม และมีรัศมีเท่ากับ $1/n_o$ และ E ray-velocity surface มีลักษณะคล้ายจานบิน ที่มีรัศมีเท่ากับ $1/n_E$ ซึ่ง ray-velocity surface ของภาคตัดหลักแสดงในรูป 2.11(b)



รูป 2.11 (a) ภาคตัดหลักแสดงผิวความเร็วของคลื่นแสงในทิศทางรังสีของ ผลึกแกนแสงเดี่ยวชนิด บวก (b) ภาคตัดหลักซึ่งแสดง ผิวความเร็วของคลื่นแสงในทิศทางรังสีของ ผลึกแกนแสงเดี่ยวชนิด ลบ (Wahlstrom, 1969)

2.4 อันตรกิริยาระหว่างไอออกอนกับวัสดุ

อันตรกิริยาระหว่างไอออกอนกับวัสดุที่เกิดขึ้นในกระบวนการการฝังไอออกอน รายละเอียดกล่าวไว้ใน Liangdeng (1997) ในที่นี้จะกล่าวถึงไวด์พอสังเขป คือเมื่อไอออกอนปฏิสูมภูมิชีงมีประจุ มวลและพลังงานถูกเร่งให้วิ่งเข้าชนและฝังตัวลงบนผิววัสดุ จะมีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ดังแสดงในรูป 2.12



รูป 2.12 อันตรกิริยาระหว่างไอออกอนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง (Liangdeng, 1997)

เนื่องจากที่บริเวณผิวของเป้ามีการชนกันของไอออกอนและอะตอมของเป้า ทำให้อะตอมของเป้าสูญเสียอิเล็กตรอนบางส่วน อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เรียกว่า อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) ในขณะที่ไอออกอนชนกับอะตอมของเป้า อิเล็กตรอนของอะตอมจะถูกกระตุ้น เมื่อมันเคลื่อนที่สูญเสียพลังงานต่ำกว่า ก็จะปลดปล่อยโฟโตน (photons) ซึ่งอาจเป็นแสงช่วงที่ตามองเห็น (visible light) หรือรังสีเอกซ์ (X-rays) ออกมานา

ขณะฟังไอออกอนเมื่ออะตอมบริเวณผิวได้รับพลังงานสูงกว่าพลังงานที่ยึดระหว่างอะตอมบริเวณพื้นผิว อะตอมเหล่านี้ก็สามารถหลุดออกจากของแข็งนั้นได้ เรียกว่า sputtered atom ปริมาณอะตอมบริเวณพื้นผิวที่กระเจิงออกต่อปริมาณของไอออกอนที่ใช้เรียกว่า sputtering yield, Y โดย

ค่า sputtering yield ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น พลังงานของไอออนที่ใช้ จำนวนడิส ชนิดของไอออนและเป้า มุมที่ใช้ในการฝังและการจัดเรียงตัวของวัสดุที่เป็นเป้า

ความหนาของบริเวณที่เกิดการกระเจิง สามารถคำนวณได้จากสมการ (2.4)

$$Z = \frac{Yf}{N} \quad (2.4)$$

Z คือ sputtering thickness

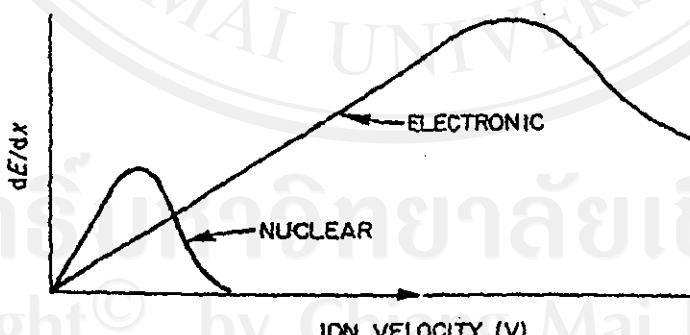
Y คือ Sputtering yield

f คือ ion dose

N คือ target atom density

2.4.1 การสูญเสียพลังงานของไอออน

การสูญเสียพลังงานของไอออนจะพิจารณาเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเกิดอันตรกิริยะระหว่างไอออนกับนิวเคลียสของอะตอม เป้า หรือที่เรียกว่า nuclear stopping การสูญเสียพลังงานนี้จะเกิดเมื่อไอออนมีพลังงานต่ำ การสูญเสียพลังงานอีกอย่างคือ การสูญเสียพลังงาน เนื่องจากอันตรกิริยะระหว่างไอออนกับอิเล็กตรอนในเป้า เรียกว่า electronic stopping ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไอออนมีพลังงานสูง ดังแสดงในรูป 2.13



รูป 2.13 ความเร็วของไอออนที่มีผลต่อ nuclear stopping และ electronic stopping

(Liangdeng, 1997)

2.4.2 Stopping cross section

เมื่อไออ่อนเข้าชนเป้ามันจะสูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนกับอะตอมของเป้า และในที่สุดจะหยุด การสูญเสียพลังงานนี้อธิบายได้โดย stopping cross section (S)

$$S(E) = \frac{-1}{N} \frac{dE}{dx} \quad (2.5)$$

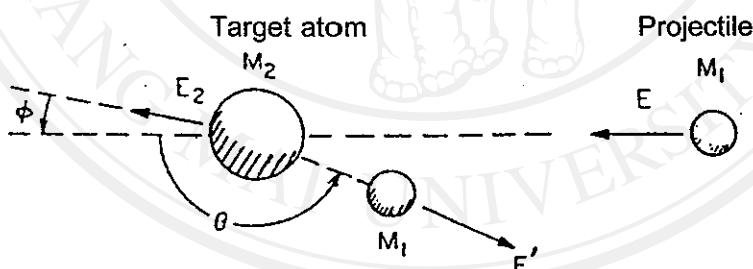
โดย S คือ พลังงานที่สูญเสียไปเมื่อไออ่อนเคลื่อนที่ผ่านระยะทางหนึ่งในเป้า

E พลังงานในการเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง x

N จำนวนความหนาแน่นของอะตอมที่เป็นเป้า

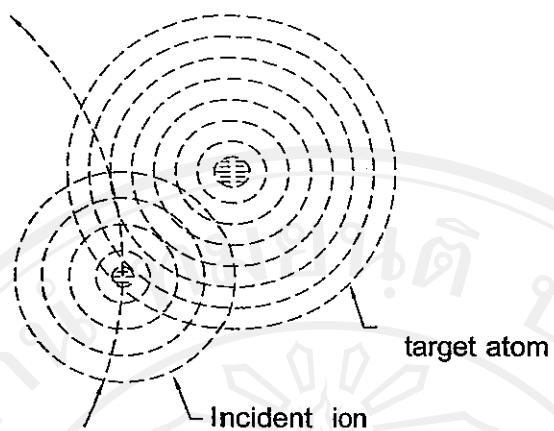
$-dE$ พลังงานที่สูญเสียไปของไออ่อนเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะ dx

Nuclear stopping (S_n) เป็นการชนแบบยึดหยุ่น (elastic collision) ระหว่างนิวเคลียส 2 ตัว เนื่องจากแรงคูลومบ์ ดังรูป 2.14 เป็นการถ่ายเทพลังงานจากไออ่อนไปยังอะตอมของเป้า ทำให้เปลี่ยนจุดศูนย์กลางมวลของอะตอมที่ถูกชน ปกติกระบวนการนี้จะเกิดที่พลังงานต่ำกว่า 20 keV



รูป 2.14 การชนแบบยึดหยุ่นของอะตอมที่เคลื่อนเข้าชนกับอะตอมของเป้า (Liangdeng, 1997)

Electronic stopping (S_e) เป็นการชนแบบไม่ยึดหยุ่น (non-elastic collision) ระหว่างกลุ่มอิเล็กตรอนของไออ่อนและเป้า ดังรูป 2.15 กระบวนการนี้มักจะเกิดที่พลังงานมากกว่า 10-20 keV เพราะเมื่อพลังงานสูง ไออ่อนสามารถเข้าใกล้อะตอมของเป้าได้ทำให้เกิดอันตรกิจิยา ระหว่างกลุ่มของอิเล็กตรอนทั้งสองและมีการถ่ายเทพลังงานระหว่างอิเล็กตรอนเกิดขึ้น กระบวนการนี้จะซับซ้อนกว่ากระบวนการแรก

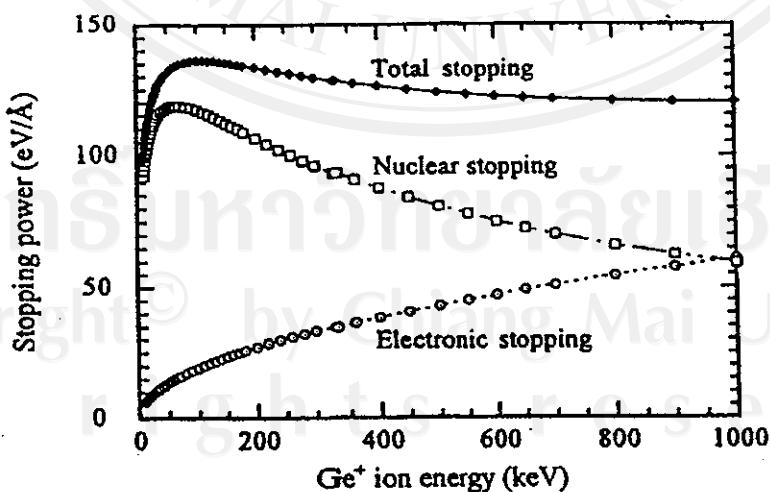


รูป 2.15 อันตรกิริยาของกลุ่มหมอกอเล็กตรอนระหว่างอะตอมของไอโอดินและอะตอมของเป้า (Liangdeng, 1997)

โดยผลรวมระหว่าง nuclear stopping (S_n) กับ electronic stopping (S_e) เรียกว่า total stopping (S) เป็นไปดังสมการที่ (2.6)

$$S = S_n + S_e \quad (2.6)$$

ความสัมพันธ์ระหว่าง nuclear stopping, electronic stopping และ total stopping เป็นดังรูป 2.16



รูป 2.16 Stopping power ของ Ge⁺ ในชิลิกอนอสัณฐาน (Songsiriritthigul, 1997)

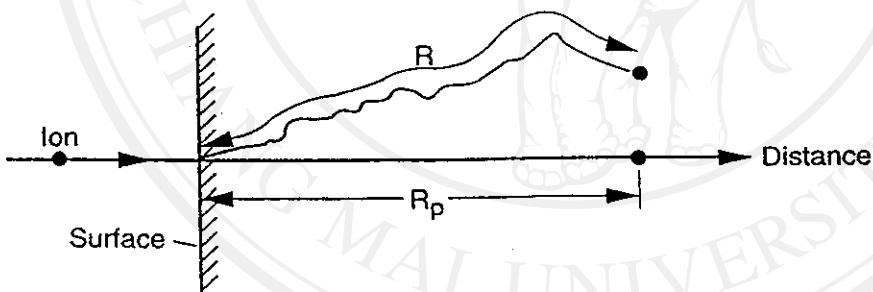
เนื่องจากมีการศูนย์เสียพลังงานจากการชนกันระหว่างไอโอนเริ่มต้นและอะตอมของเป้า เมื่อไอโอนหรืออะตอมมีพลังงานต่ำกว่าพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ อะตอมก็จะหยุดนิ่ง

จากรูป 2.17 ระยะทางทั้งหมดที่ไอโอนใช้ในการเคลื่อนที่เรียกว่า total path length (R) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.5) ดังนี้

$$R = \int_0^{E_0} \frac{dE'}{NS(E')} \quad (2.7)$$

เมื่อ E_0 คือ พลังงานของไอโอน

เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นมีไอโอนจำนวนมากที่เข้าชนเป้า จึงใช้ระยะทางตั้งจากผิวของเป้าถึงจุดที่ไอโอนหยุด เป็นความลึกที่ไอโอนฝังตัว (penetration depth) เรียกวะระยะนี้ว่า projected range (R_p) ดังรูป 2.17



รูป 2.17 total path length และ project range ของไอโอนในวัสดุ (Nastasi et al., 1996)

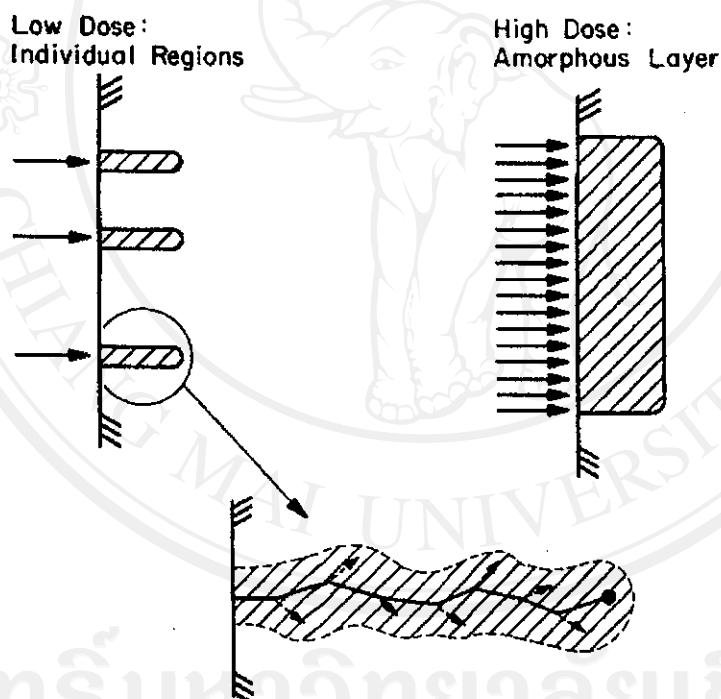
วิธีการที่ใช้ในการคำนวณหา ion range ส่วนมากจะใช้เทคนิค Monte Carlo ซึ่งจะมีโปรแกรมพิวเตอร์สำหรับรูป เรียกว่า TRIM (Transport of Ion in Matter) program

2.4.3 ความไว้ระเบียบของผลึกเนื่องจากการฝังไอโอน

Mayer และคณะ (1970) ได้กล่าวถึงความไว้ระเบียบของผลึกที่เกิดจากการฝังไอโอนว่า เกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างการฝังไอโอนจะมีการชนกันของไอโอนและอะตอมของเป้า ถ้าพลังงานที่ใช้ในการชนมีขนาดมากกว่าพลังงานวิกฤต (critical energy) ของการเคลื่อนที่ของอะตอม

อะตอมของของแข็งก็จะสามารถเกิดการเคลื่อนที่ (atomic displacement) ได้และถ้าอะตอมที่เคลื่อนที่ไปมีพลังงานสูงพอก็จะชนอะตอมอื่นๆ ต่อไปอีก จึงทำให้เกิดขุดของกราฟนและกราฟเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องกัน เรียกว่ากระบวนการนี้ว่า collision cascade ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เป็นระเบียบของผลึก (lattice disorder) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้จะทำให้เกิดตำแหน่ง (defect) ต่างๆ ขึ้นมา เช่น ช่องว่าง (vacancies) การแพร่แบบแทรกที่ (interstitials) การแพร่แบบเฟรงเกล (Frenkel) เป็นต้น

นอกจากนี้ได้สังเกตว่ามีความสำคัญต่อปริมาณที่เกิดความไม่เป็นระเบียบ คือ เมื่อได้สั่นต่ำบปริมาณที่ไม่เป็นระเบียบจะแยกกัน และหากได้สูงพอก็จะเกิดการซ้อนทับกัน ทำให้เกิดเป็นริ้วนของสันฐานขึ้น ดังรูป 2.18

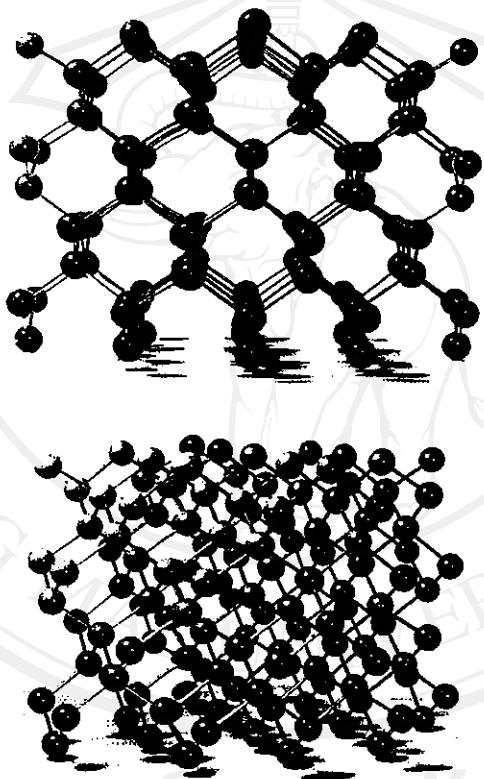


รูป 2.18 ความไม่ระเบียบของแลตทิซในวัสดุที่เป็นเป้า (Nastasi et al., 1996)

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างไอโอดินและอะตอมของเป้า อาจทำให้เกิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่ต่อก่อนในรูปของเฟสทุติยภูมิ (secondary phase precipitation) หรือทำให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นอสันฐาน (amorphous) หากใช้ไดส์ที่สูงพอก็ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

ของเฟส (phase transformation) เกิดขึ้น เช่นการผังไอโอดินของไนโตรเจนลงไปในเหล็กกล้าทำให้เกิดเป็นเหล็กไนโตรด (Fe-nitride) ซึ่งทำให้วัสดุนั้นมีความแข็งเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาผังตัวของไอโอดินคือทิศทางที่ไอโอดินเคลื่อนเข้าไปในโครงสร้างของผลึก ในบางทิศทาง เช่นในรูปที่ 2.19 (บน) เป็นทิศทางตามแนว $<110>$ ของผลึกซิลิกอนจะเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างอะตوم ช่องว่างเหล่านี้จะสามารถทำให้ไอโอดินผังในผลึกได้ระหว่างทางทะลุทะลวงที่สูงกว่าในรูปล่าง ซึ่งเป็นทิศที่ทำมุ่ง 10 องศา จากด้าน $<110>$



รูป 2.19 (บน) โครงสร้างผลึกของซิลิกอนในทิศทาง $<110>$ และ (ล่าง) ที่มุ่ง 10 องศาจากทิศทาง $<110>$ (Mayer et al., 1970)

All rights reserved

2.5 การแพร่ของอะตอมในของแข็ง

การแพร่ (diffusion) เป็นกลไกของการเคลื่อนที่ของอะตอมของสารชนิดหนึ่งเข้าไปสู่สารอีกชนิดหนึ่ง การแพร่ในสถานะของแข็งจะถูกควบคุมด้วยพันธะเคมีที่ยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมโดย Askeland (1996) ได้กล่าวถึงการแพร่ของอะตอมในของแข็ง มีรายละเอียดดังนี้

กลไกการแพร่ของอะตอมในโครงผลึกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

i) กลไกการแพร่แบบซ่องว่างหรือแบบแทนที่ (vacancy or substitutional diffusion mechanism)

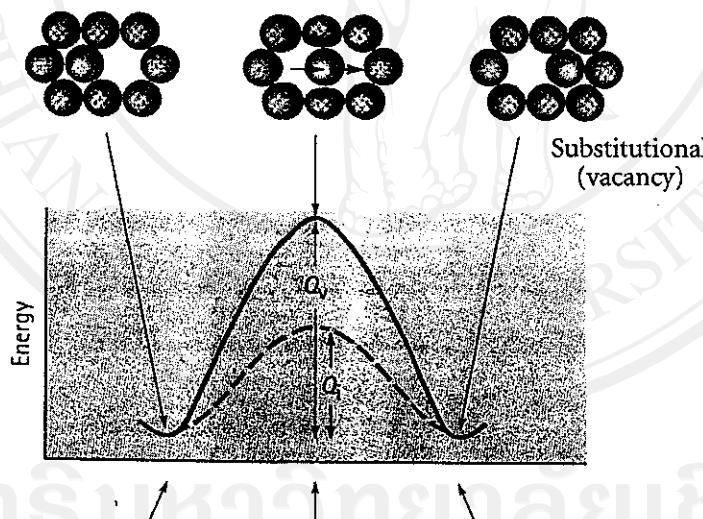
อะตอมสามารถเคลื่อนที่ในโครงผลึกจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหากอะตอมนั้นมีพลังงานก่อภัยมั่นต์ (activation energy, Q) เพียงพอ โดยในโครงสร้างผลึกนั้นต้องมีตำแหน่งแบบซ่องว่าง (vacancy defect) อยู่ อะตอมที่อยู่รอบๆ ซ่องว่างสามารถเข้าแทนที่ในซ่องว่างได้ หากอะตอมมีพลังงานก่อภัยมั่นต์มากกว่าพลังงานขวางกัน (energy barrier) โดยค่าของพลังงานขวางกันนี้ขึ้นกับชนิดของพันธะเคมีที่ยึดระหว่างอะตอม พลังงานก่อภัยมั่นต์ของ การแพร่แบบแทนที่จะมีพลังงานสูงกว่าแบบแทรกที่ (ดังรูป 2.21) การให้ความร้อนสามารถทำให้อะตอมเกิดการสั่นและหลุดออกจากตำแหน่งเดิมโดยเป็นช่องว่าง (vacancy) หรือความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นในโครงผลึก หากซ่องว่างเหล่านี้มีมากอัตราการแพร่ก็จะสูงขึ้นด้วย อัตราเร็วในการแพร่ของอะตอมนอกจากขึ้นกับพลังงานพันธะระหว่างอะตอมแล้วยังขึ้นกับขนาดของอะตอมด้วย คืออะตอมที่มีขนาดใหญ่และพลังงานพันธะระหว่างอะตอมสูงอัตราเร็วในการแพร่ของอะตอมจะต่ำ การเคลื่อนที่เข้าแทนที่ของอะตอมชนิดเดียวกันจากตำแหน่งที่อยู่รอบๆ ซ่องว่าง เรียกการแพร่ลักษณะนี้ว่า self-diffusion โดยกลไกการแพร่แบบแทนที่แสดงดังรูป 2.20 (a)

ii) กลไกการแพร่แบบแทรกที่ (interstitial diffusion mechanism)

กลไกการแพร่แบบแทรกที่นี้เกิดขึ้นได้เมื่ออะตอมที่แพร่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมของโครงสร้างผลึก โดยอะตอมขนาดเล็กจะเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่แทรกอยู่เดิมไปแทรกในตำแหน่งใหม่ระหว่างอะตอมที่อยู่ข้างเคียง ดังรูป 2.20(b) การแพร่แบบนี้เกิดขึ้นได้เร็ว เช่น การแพร่ของอะตอม H, O, N, C ในโครงผลึกของโลหะ เป็นต้น



รูป 2.20 (a) การแพร่แบบซ่องว่างหรือแบบแทนที่ (b) การแพร่แบบแทรกที่ (Askeland, 1996)



รูป 2.21 พลังงานก่อภัยมันต์ของการแพร่แบบแทนที่และแบบแทรกที่ (Askeland, 1996)

2.5.1 การแพร่ในสถานะคงตัว

การแพร่ในสถานะคงตัวเป็นการแพร่ของอะตอมจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยความเข้มข้นที่ต่ำแห่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น การแพร่ของก๊าซผ่านแผ่นโลหะบาง โดยไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างอะตอมที่แพร่และอะตอมของโลหะ เรียกการแพร่แบบนี้ว่า การแพร่ในสถานะคงตัว (steady state) แสดงดังสมการของ Fick's first law ดังนี้

$$J = -D \frac{dc}{dx} \quad (2.8)$$

เมื่อ J คือ พลักซ์ (flux) หรืออัตราการถ่ายโอนของอะตอม ($\text{atom}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$)

D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (cm^2/s)

$\frac{dc}{dx}$ คือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตามระยะทาง ($\text{atom}/\text{cm}^3 \cdot \text{s}$)

สมการที่ 2.8 เครื่องหมายลบ เพราะการแพร่เกิดขึ้นจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังที่ที่มีความเข้มข้นต่ำ เมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ้น

2.5.2 การแพร่ในสถานะไม่คงตัว

การแพร่ในสถานะไม่คงตัว (non-steady state) เป็นกระบวนการแพร่ที่ความเข้มข้นของอะตอม ณ บริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งเป็นไปตามกฎของ Fick's second law

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \quad (2.9)$$

เมื่อ C_s คือ ความเข้มข้นของอะตอมที่ผิวของแข็ง

C_0 คือ ความเข้มข้นของอะตอมที่มีอยู่ในของแข็งก่อนการแพร่

C_x คือ ความเข้มข้นของอะตอมที่ระยะห่างจากผิว x ที่เวลา t

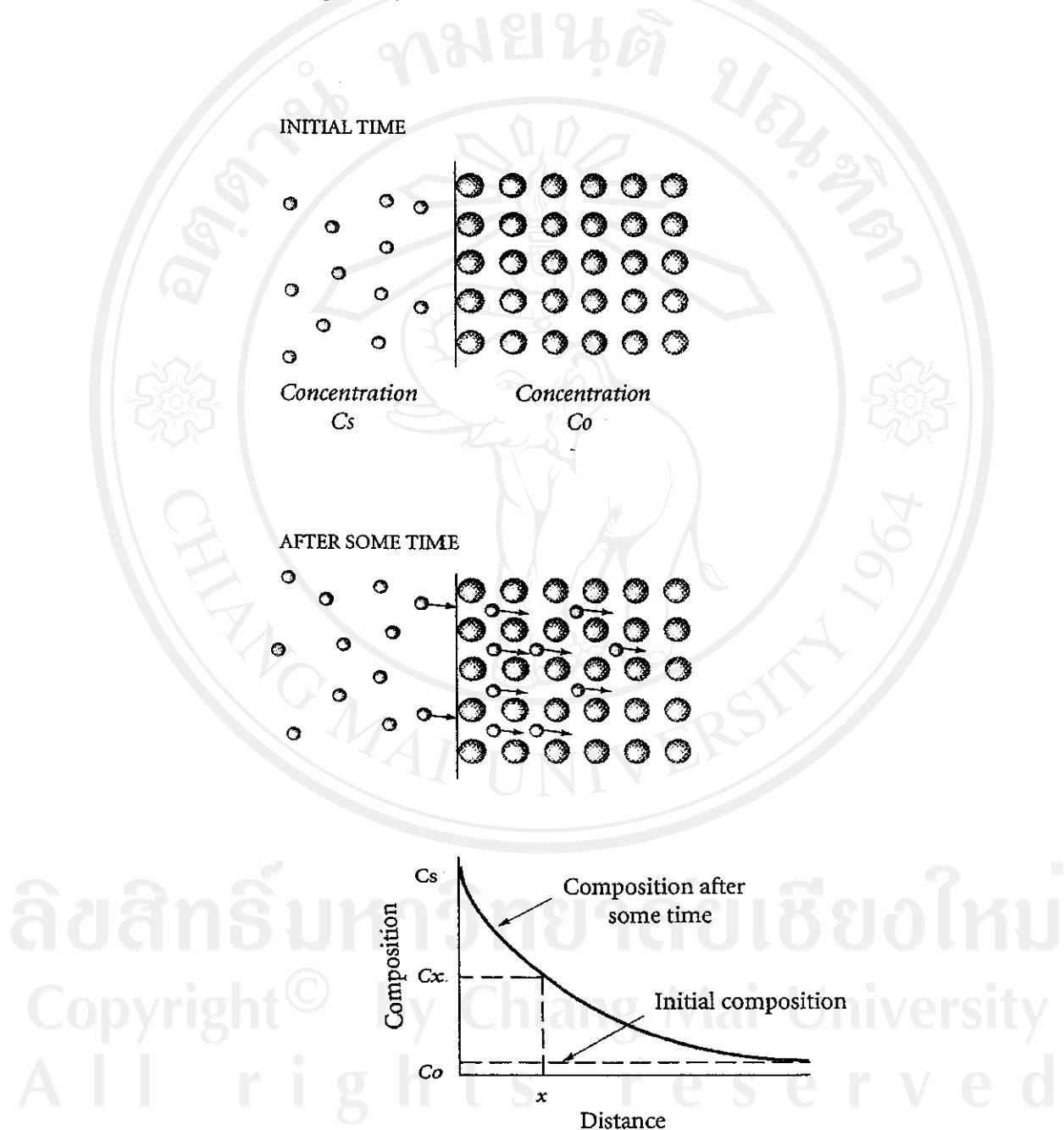
D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของอะตอม

x คือ ระยะทางจากผิว

t คือ เวลาที่อะตอมใช้ในการแพร่

erf คือ error function

พิจารณากราฟ 2.22 แสดงปริมาณรอยต่อระหว่างตัววัสดุและอะตอมที่อยู่นอกผิววัสดุ เมื่อเวลาผ่านไปอะตอมจากภายนอกจะแพร่เข้าไปในตัววัสดุ โดยความเข้มข้นของอะตอมที่แพร่เข้าไปจะมีปริมาณสูงสุดที่บริเวณพื้นผิว และค่อย ๆ ลดลงเมื่อลึกเข้าไปในตัววัสดุ ดังนั้นในการแพร่แบบนี้ปริมาณของอะตอมที่แพร่เข้าสู่ผิววัสดุขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการแพร่และระยะทางที่แพร่เข้าไป



รูป 2.22 การแพร่ของอะตอมเข้าสู่ภายในผิววัสดุ (Askeland, 1996)

2.5.3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสัมประสิทธิ์การแพร่

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะมีผลให้อัตราเร็วในการแพร่ของอะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่อุณหภูมิสูงพลังงานจากความร้อนจะกระตุ้นให้อะตอมมีพลังงานมากกว่า energy barrier ทำให้อะตอมเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น แต่ที่อุณหภูมิต่ำ (ปกติจะต่ำกว่า 0.4 เท่าของอุณหภูมิหลอมเหลว) การแพร่จะเกิดขึ้นได้ช้ามาก อัตราในเรื่องการแพร่ของอะตอมขึ้นกับค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ตามสมการของ Arrhenius ดังสมการ (2.10) ซึ่งตัวอย่างของค่า Q และ D_0 ของอะตอมที่เป็นตัวถูกละลายในของแข็งบางชนิดแสดงดังตารางที่ 2.2

$$D = D_0 e^{-Q/RT} \quad (2.10)$$

เมื่อ D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ที่อุณหภูมิ T (m^2/s)

D_0 คือ ค่าสัดส่วนคงที่โดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ (m^2/s)

Q คือ พลังงานก่อการมั่นคงของอะตอมที่แพร่เข้าไป (J/mol)

R คือ ค่าคงที่ของก้าซ (8.314 $\text{J}/(\text{mol.K})$)

T คือ อุณหภูมิ (K)

ตารางที่ 2.2 ค่า Q และ D_0 ของอะตอมที่เป็นตัวถูกละลายในของแข็งบางชนิด(Askeland, 1996)

Diffusion Couple	Q (J/mol)	D_0 (m^2/s)
Ni in Cu	242,350	2.3×10^{-4}
Cu in Ni	257,450	6.5×10^{-5}
Zn in Cu	183,750	7.8×10^{-5}
Al in Cu	165,350	4.5×10^{-6}
Al in Al_2O_3	477,200	2.8×10^{-3}
O in Al_2O_3	636,250	0.19
Mg in MgO	330,700	2.49×10^{-5}
O in MgO	343,650	4.3×10^{-9}

2.6 การศึกษาเกี่ยวกับการฝังไออกอนบนอะลูมิเนียมออกไซด์

อะลูมิเนียมออกไซด์ที่พบในธรรมชาติจะอยู่ในเฟสอัลฟा ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) ส่วนเฟสอื่น เช่น $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ซึ่งมีโครงสร้างเป็น hexagonal และ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ มีโครงสร้างเป็น cubic สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ แต่โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็น $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ เมื่อได้รับความร้อน (Deer et al., 1962) การสังเคราะห์อะลูมิเนียมออกไซด์นิยมสังเคราะห์แบบ Vernuil process (Klein, 2002) ซึ่งใช้หลักการหลอมละลายโดยใช้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 2200°C หลอมผงเคมีที่มีส่วนประกอบของ Al_2O_3 (alumina powder) ให้ละลายหยดลงสู่ฐานที่มุนรอบตัวเอง เนื่องจากบริเวณฐานมีอุณหภูมิต่ำกว่าทำให้ผงเคมีที่หยดลงมาเกาะติดกันเกิดเป็นผลึก (Hughes, 1997) หากต้องการให้คงร้นดัมมีสีต่างๆ ทำได้โดยการเติมธาตุโลหะเพื่อให้เกิดออกไซด์ของโลหะ (metallic oxides) เช่น การเติม โคโรเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) และไทเทเนียม (Ti) เป็นต้น

ในการฝังไออกอนบนอะลูมิเนียมออกไซด์นั้น สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณพื้นผิว สมบูรณ์แบบ รวมทั้งทำให้เกิดตำแหน่งขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดตำแหน่งในชั้นงานนั้นมีหลายประการ เช่น ชนิดของไออกอนและวัสดุที่เป็นเป้า ปริมาณของไออกอน พลังงานที่ใช้ ทิศทางการฝังไออกอน อุณหภูมิและบรรยากาศที่ใช้ในการอบ (annealing) หลังการฝัง ตำแหน่งที่เกิดในช่องร่องของออกซิเจนจากการฝังไออกอนบนอะลูมิเนียมออกไซด์และตำแหน่งการดูดกลืนแสงของตำแหน่งที่เกิดขึ้น แสดงในตารางที่ 2.3

การทดลองของ Chen และคณะ (1991) ได้ทดลองเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการฝัง Fe^{2+} พลังงาน 3.8 ล้านอีเล็กตรอนโวลท์ (MeV) บน $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ผิวน้ำดั้งเดิมกับแกน C ที่ทดสอบ 0.5×10^{16} และ 2×10^{16} ไออกอน/ ซม^2 จากสเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบรากурсกีลินแสงมากที่สุดที่ 6.2 อิเล็กตรอนโวลท์หรือประมาณ 200 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงของ F center (ซึ่งว่าในตำแหน่งของออกซิเจนที่มีอิเล็กตรอน 2 ตัว) ส่วนข้อบกพร่องชนิดอื่นๆ เช่น F^+ และ F_2 centers ไม่สามารถมองเห็นจากการวัดการดูดกลืนแสง แต่สามารถพบได้ด้วยการวัดการเจืองแสง (luminescence) และเทคนิค electron paramagnetic resonance (EPR) การศึกษาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิทำโดยอบตัวอย่างหลังฝังไออกอน พบร่วมกับความเข้มของ F center ลดลง และไม่สามารถวัดได้โดย EPR หลังจากอบที่อุณหภูมิ 800 เคลวิน

ตารางที่ 2.3 ตัวหนินิในช่องว่างของออกซิเจนในอะลูมิเนียมออกไซด์และตัวแหน่งการดูดกลืนแสง
ของตัวหนินิ (Chen et al., 1991; Katano et al., 1996)

จำนวนช่องว่าง ของออกซิเจน	จำนวนอิเล็กตรอน ที่ถูกดัก	สัญลักษณ์ ของตัวหนินิ	การดูดกลืนแสง		เอกสารอ้างอิง
			นาโนเมตร	อิเล็กตรอนโวลท์	
1	2	F	205	6.05	Chen et al., 1991
			210	6.4	Katano et al., 1996
1	1	F^+	258	4.8	Chen et al., 1991
			230	5.4	Katano et al., 1996
2	4	F_2	225	5.5	Chen et al., 1991
			203	6.1	Chen et al., 1991
2	3	F_2^+	300	4.1	Chen et al., 1991
2	2	F_2^{2+}	355	3.5	Chen et al., 1991
			455	2.7	Chen et al., 1991

ในการวัดการดูดกลืนแสงนั้น Saito และคณะ (1991) ได้ฝังโคบลต์ไอโอน บนแฟไฟร์ สังเคราะห์ไสเมมีสี ด้วยพลังงาน 20 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ ที่โดย 5×10^{16} ถึง 5×10^{17} ไอโอน/ ซม^2 การวัดการดูดกลืนแสงในช่วง 400-700 นาโนเมตร ก่อนและหลังอบ พบร้าตัวอย่างหลังการฝัง ไอโอนจะมีสีเทาเข้มแต่เมื่อให้ความร้อนที่ 800 °C เวลา 3 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และเปลี่ยน เป็นสีน้ำเงินอ่อนเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1000 °C เวลา 3 ชั่วโมง การศึกษาด้วย XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) พบรีกนลักษณะของการจัดเรียงตัว ของอิเล็กตรอน (electronic configurations) สองแบบ ทำให้มีค่าพลังงานก่อภัยมันต์ต่างกันด้วย ทำให้มองเห็นสีที่แตกต่างกัน

Zhou และ Sood (1991) ได้ทดลองฝัง O^+ พลังงาน 55 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ บนผิวเดี่ยว ของ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ที่โดย 1.0×10^{15} ถึง 6×10^{16} ไอโอน/ ซม^2 จากการตรวจสอบด้วย SEM ไม่พบการ พองตัว (blistering) ใด ๆ เกิดขึ้น แต่เมื่อขึ้นงานเหล่านั้นผ่านการอบ ในบรรยากาศของออกซิเจนที่ อุณหภูมิ 700, 800 และ 900 °C เวลา 0.5 – 7 ชั่วโมง พบร้าการฝังไอโอนที่โดยต่ำไม่พบการพอง ตัวเกิดขึ้น จึงค่าโดยวิกฤต (critical dose) ที่ทำให้เกิดการพองตัวคือที่โดยตั้งแต่ $(3-4) \times 10^{16}$ ไอโอน/ ซม^2 การที่ไม่พบการพองตัวในตัวอย่างที่ไม่ผ่านการอบเพราเวลดิชของ Al_2O_3 นั้นไม่ ยคงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนขององค์ประกอบขึ้น ดังนั้นเมื่อออกซิเจนส่วนเกินนี้ถูกฝังลง ใน Al_2O_3 จะประพฤติตัวเหมือนก้าซเจีย และไม่สามารถเกิดพันธะกับแอนไฮดอนได้ เมื่อ

ออกซิเจนเหล่านี้ได้รับความร้อนที่ประมาณ 700 °C จะมีอิสระในการเคลื่อนที่จึงเกิดการรวมตัว (agglomeration) กันเนื่องจากความสามารถในการละลายใน Al_2O_3 มีน้อยมาก การทดลองนี้พบว่าโดยวิถีๆ ที่ทำให้เกิดการพองตัวและడิสท์ฟาร์มให้เกิดอัลลอยด์ (amorphisation) นั้นมีค่าเท่ากัน จึงต้องศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์นี้ต่อไป

Ikeyama และคณะ (2001) ฝังไอโอดินของออกซิเจนและทองแดงบนแซฟไฟร์ โดยเปลี่ยนอัตราส่วนของ O และ Cu คือ 0:1 0.5:1 และ 1:1 โดย Cu^+ ions ใช้พลังงาน 2.1 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ డิส Cu คือ 1×10^{17} ไอโอดิน/ cm^2 แต่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของออกซิเจนไอโอดิน คือ $0, 0.5 \times 10^{17}$ ($1/2 \text{O} + \text{Cu}$) และ 1×10^{17} ($\text{O} + \text{Cu}$) ไอโอดิน/ cm^2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลังฝังไอโอดิน หลังจากนั้นทำการปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อน (heat treatment) ที่อุณหภูมิ 1270 เคลวิน เวลา 1 ชั่วโมง การดูดกลืนแสงจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่ประมาณ 570 นาโนเมตร หลังการฝังไอโอดินพบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบ ขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคของ Cu จะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการเกิดอนุภาคขนาดนาโนของทองแดง (Cu nanoparticles)

Marques และคณะ (2002) ทดลองฝังโคบล็อกต์ไอโอดิน พลังงาน 150 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ ลงบน $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ที่ได้ด้วยడิส 1×10^{16} ถึง 5×10^{17} ไอโอดิน/ cm^2 พบร่วมกับการดูดกลืนเนื่องจากความเสียหายจากการฝังไอโอดินจะเห็นได้ชัดที่ 200 นาโนเมตร การอบตัวอย่างในบรรยากาศของออกซิเจนจะทำให้ไอโอดินของ Co เกิดการแพร่และเกิดเป็นสารประกอบของ Co-Al-O ขึ้น กระบวนการอบในบรรยากาศ reducing จะทำให้เกิดชั้นของ Co (Co-rich) มีความหนาประมาณ 80 นาโนเมตร ชั้นงานจะมีสีน้ำตาลดำ ซึ่งเป็นลักษณะของความเสียหายที่เกิดจากการฝังไอโอดิน

นอกจากนี้การทดลองของ Marques และคณะ (2000) โดยการฝัง W^+ ดิส 5×10^{15} ถึง 1×10^{16} พลังงาน 150 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ และ Cr^+ ดิสตั้งแต่ 3×10^{16} ถึง 3×10^{17} ไอโอดิน/ cm^2 พลังงาน 170 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ พบร่วมกับการดูดกลืนแบบเปลี่ยนไปในช่วงอินฟราเรดช่วงใกล้ (near infrared) ที่ 2000-3000 นาโนเมตร การอบตัวอย่างในช่วง 200-900°C เวลา 2.5 ชั่วโมง พบร่วมกับเม็ดสีที่เริ่มแพร่สู่ตัวชั้นงานหลังอุณหภูมิ 600°C ในขณะที่หั้งสเตนจะเริ่มคงที่ที่ 800°C และพบว่าสีของตัวอย่างหลังฝังด้วยไอโอดินของโคโรเมียมที่ดิสสูง สีจะเปลี่ยนจากน้ำตาลดำเป็นสีเขียวอ่อนเมื่ออบที่ 800°C

McHargue และคณะ (1987) ศึกษาผลลัพธ์เมื่อของ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ที่ฝังด้วยอาร์กอน (Ar^+) ไอโอดิน (Ne^+) และไบร์มีน (Br^+) ดิส 1×10^{16} ถึง 3×10^{17} ไอโอดิน/ cm^2 พลังงาน 125 กิโลอิเล็ก-

ตรอนโอล์ฟิ่ง 3 ล้านอิเล็กตรอนโอล์ฟิ่ง พบร่วมกับการฝัง Ar⁺ โดส 1×10^{16} ไอโอน/ซม² พลังงาน 230 กิโลอิเล็กตรอนโอล์ฟิ่ง และ Ne⁺ โดส 3×10^{17} ไอโอน/ซม² พลังงาน 3 ล้านอิเล็กตรอนโอล์ฟิ่ง จะเกิดการพองตัวและหลุม (cratering) บริเวณผิวซึ่งจะเพิ่มจำนวนและขนาดขึ้นตามโดสที่ใช้ ผิวที่ได้มีลักษณะขุ่นระและไอโอนของแก๊สจะทำให้บริเวณใกล้ผิวเประและหลุดออกเมื่อใช้งานที่มีความเด่นเกี่ยวกับ การฝังไอโอนของไบร์นพบว่าเกิดการพองตัวอย่างกว่า แต่หลังการอบ ผิวด้วยอย่างจะเกิดการพองตัวและหลุดออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ McHargue และคณะ (1999) ยังได้ทดลองฝังไอโอนของเหล็ก ที่โดส 1×10^{16} ถึง 5×10^{17} ไอโอน/ซม² พลังงาน 160 กิโลอิเล็กตรอนโอล์ฟิ่ง พบร่วด้วยตัวอย่างที่ฝังไอโอนในแนวแกน c มีอัตราการเกิดตำหนินมากกว่าตามแนวแกน a และผลึกที่ฝังไอโอนตามแนวแกน c จะกล้ายเป็นอสัณฐานที่โดส 2×10^{17} ไอโอน/ซม² ในขณะที่ขึ้นงานที่ฝังไอโอนตามแนวแกน a เกิดขึ้นที่ไวร์เรบียน ที่โดส 5×10^{17} ไอโอน/ซม²

เนื่องจาก Al₂O₃ มีสมบัติเป็นชนวนไฟฟ้าที่ดีมาก ในขณะที่ฝังไอโอนจะมีการอ่อนของประจุบวกจำนวนมากบริเวณผิว Liu และคณะ (1997) กล่าวว่าประจุบวกเหล่านี้ทำให้เกิดการหน่วง (decelerate) และการ defocus ของลำไหอน ทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายบนชั้นงานโดยเฉพาะในกรณีของรัศดุลีตัวนำ วิธีการแก้ปัญหานี้ทำได้โดยการเติมอิเล็กตรอนให้ชั้นงานเพื่อให้เกิดทำให้เป็นกลาง (neutralization) ซึ่งอิเล็กตรอนนี้สามารถผลิตได้โดย flood gun จากการทดลองพบว่า cold electron สามารถทำให้เกิด neutralization ชั้น สาเหตุของการเกิด cold electron แบ่งได้เป็น 3 สาเหตุ คือ เกิดจาก ionization ของ residual gas เกิดจากการเสียดสีของไอโอนกับอิเล็กตรอน บริเวณ extractor หรือเกิดจาก secondary electron ที่เกิดจากการชนของนีมกับชั้นงาน และตัวภายนอกชั้นงาน

การเกิด charging เป็นปัญหาหลักในระหว่างการฝังไอโอนในสารกึ่งตัวนำ โดยประจุบวกที่เกิดขึ้นบนชั้นงานจะเป็นสาเหตุให้เกิด dielectric breakdown โดย Sakai และคณะ (1995) ทดลองโดยยึดชั้นงานไว้ทางด้านในของ Faraday cup ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ชั้นงานเป็น aluminum film (500 nm) และ silicon wafer วัดความต่างศักย์ระหว่างฝังไอโอนของ C⁺ และ C⁻ ในกรณีของ positive-ion implantation พบร่วม charging voltage จะเพิ่มชั้นตามพลังงานของไอโอนที่ใช้และจะขึ้นไปจนเกือบจะเท่ากับ voltage ของไอโอนที่ถูกเจาะช่องอยู่ในช่วง 1-8 กิโลอิเล็กตรอนโอล์ฟิ่ง ในขณะที่ negative- ion implantation จะเกิด charging voltage ต่ำมากคือ 1-4 กิโลฟิล์ฟ

จากการวิจัยเหล่านี้จะเห็นว่าการฝังไอกอนใน Al_2O_3 นั้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หลายอย่าง และมีผลลัพธ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทดลองเหล่านี้จึงเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของหับพิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์ในการทดลองนี้ต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved